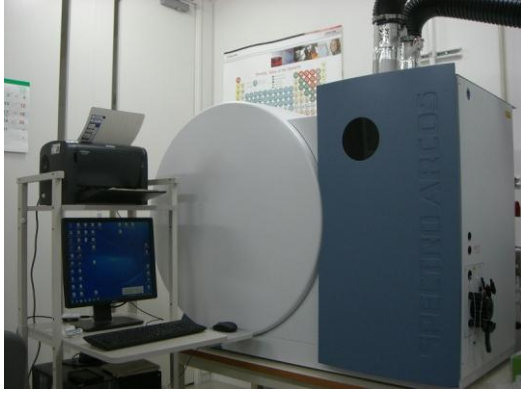


瀬戸市記者会、豊田市政記者クラブ、
豊田市政記者東クラブ、長久手市同時



材料の微量成分を分析する
ICP 発光分析装置

平成26年11月18日（火）
あいち産業科学技術総合センター
共同研究支援部 計測分析室
担当 杉本、棚橋、加藤
ダイヤルイン 0561-76-8315
愛知県産業労働部産業科学技術課
管理・調整グループ
担当 加藤、水野
内線 3389、3388
ダイヤルイン 052-954-6347

計測分析に関する講演会の参加者を募集します 「金属・セラミックス材料の組成分析」～成分とその分布～

あいち産業科学技術総合センターでは、種々の高度分析機器を用いた分析・評価により、企業の方々の新技術・新製品開発への取組みや現場の課題解決を支援しています。

このたび、ご相談の多い新製品開発や、異物の分析に際しての「金属・セラミックス材料の組成分析」に焦点をあてた講演会を、平成27年1月30日（金）に開催します。講演会では、走査電子顕微鏡（SEM）^{*1}を用いた材料の組成分布や、ICP発光分析装置（ICP-AES）^{*2}・蛍光X線分析装置（EDS）^{*3}による主成分・微量成分の分析について、様々な事例をご紹介します。

講演後は、計測分析に関する個別の技術相談会や、当センターの計測分析機器及び隣接するあいちシンクロトン光センター^{*4}の見学会を行います。

参加費は無料です。多くの皆様のご参加をお待ちしております。

1 日時

平成27年1月30日（金） 午後1時30分から午後4時45分まで

2 場所

あいち産業科学技術総合センター 1階 講習会室
住所：豊田市八草町秋合1267-1 電話：0561-76-8315
（東部丘陵線リニモ「陶磁資料館南」駅 下車すぐ）
※会場へは公共交通機関を利用してお越しください。

3 主催等

主催：あいち産業科学技術総合センター
共催：（公財）科学技術交流財団

4 内容

・「FE-SEMによる成分分析事例紹介」

講師：株式会社日立ハイテクノロジーズ 課長 ^{わたなべ としや} 渡邊 俊哉氏
(午後1時40分～2時40分)

・「バルクの主成分と微量成分の分析について ～ICP発光分析装置及び蛍光X線(EDS)装置を用いた分析事例紹介～」

講師：株式会社日立ハイテクサイエンス 課長 ^{なみき けんじ} 並木 健二氏
(午後2時50分～3時50分)

・「当センターにおけるICP-AESによる測定事例の紹介」

担当：あいち産業科学技術総合センター 共同研究支援部
計測分析室 技師 ^{たなはし のぶひと} 棚橋 伸仁
(午後4時00分～4時15分)

・技術相談会および見学会(希望者のみ)

あいち産業科学技術総合センター
(走査電子顕微鏡、蛍光X線分析装置、ICP発光分析装置、他)
あいちシンクロトロン光センター
(午後4時15分～4時45分)

5 参加費

無料

6 定員

100名(先着順)

7 申込方法

技術開発に取り組む企業の方々を始め、どなたでも自由に参加できます。
参加申込書に必要事項を記入の上、FAX、郵送または電子メールでお申込みください。
申込書はあいち産業科学技術総合センターのホームページ(<http://www.aichi-inst.jp/>)
からダウンロードできます。

8 申込期限

平成27年1月29日(木)午後5時まで(必着)
※定員に達し次第締め切ります。また、技術相談会については、希望者多数の場合、
抽選とさせていただきます。ご了承ください。
※参加受付証は発行しません。お申込みの上、直接会場にお越し下さい。なお、定員
超過の場合及び技術相談会が抽選となった場合は連絡させていただきます。

9 申込先及び問い合わせ先

あいち産業科学技術総合センター 共同研究支援部
計測分析室 杉本、棚橋、加藤
〒470-0356 豊田市八草町秋合1267-1
電話：0561-76-8315 FAX：0561-76-8317
mail：AIC0000001@chinokyoten.pref.aichi.jp
URL：http://www.aichi-inst.jp/

【用語説明】

用語	説明
*1 走査電子顕微鏡 (SEM)	真空中で、細く絞った電子線を観察試料表面で走査させ、試料から出てきた電子を捉えて検出することで、微小領域における試料表面の凹凸観察や、組成分布を得る装置。
*2 ICP 発光分析装置 (ICP-AES)	高電圧をかけてプラズマ化した気体内に霧状の液体試料を混合させることで、各元素を原子化・熱励起し、それらが基底状態に戻る際の発光スペクトルを測定することで、微量元素の分析を行う装置。
*3 蛍光 X 線分析装置 (EDS)	試料全体に X 線を照射し、試料から出てきた特性 X 線を検出して、材料の主要な元素組成を調べる装置。
*4 あいちシンクロトロン光センター	<p>(公財)科学技術交流財団が運営する、ナノテク分野の研究開発を支援する最先端の計測分析施設。平成 25 年 3 月に「知の拠点あいち」にオープンした。愛称：Aichi SR。産業利用を主目的としており、あいち産業科学技術総合センターが備える高度計測分析機器との相互利用を図ることにより、地域企業の技術的な課題解決を強力に支援する。</p> <p>なお、シンクロトロン光とは、ほぼ光速で直進する電子が電磁石によって進行方向を変えられた際に発生する電磁波。非常に明るく (通常の計測装置で用いる電磁波の千倍から百万倍)、1 台の装置でマイクロ波、赤外、可視、紫外から X 線まで連続した波長の光を出すことができる。この光を利用して様々な計測・分析を行う。</p>